

組織委員 (五十音順・敬称略)

【委員長】 宮村 鐵夫 中央大学 教授 理工学部 経営システム工学科
【副委員長】 佐藤 吉信 東京海洋大学 教授 海洋工学部 海事システム工学科
【委員】 荒木 伸行 パナソニックモバイルコミュニケーションズ(株) 品質管理センター
 部品質グループ 部品技術チーム 主任品質技師
 井原 惇行 楠木化成(株) エタック事業部 顧問
 門田 靖 (株)リコー 品質本部 信頼性技術室 室長/製品安全性技術室 室長
 鎌田 信也 三菱重工業(株) 原子力事業本部 原子力品質・安全監査室 主席技師
 上久保 忠正 (株)日立製作所 品質保証本部 QAセンター 主任技師
 木谷 晃久 富士通(株) 品質保証本部 品質保証推進統括部 担当部長
 木村 忠正 電気通信大学 教授 電気通信学部 電子工学科
 小橋 一志 関西電力(株) 企画室 品質管理グループ チーフマネージャー
 佐々木 健二 ソニー(株) 半導体事業本部 品質信頼性部門
 信頼性技術部 担当部長
 下河 利行 宇宙航空研究開発機構 主幹研究員
 高久 清 産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター
 評価・システムチーム テクニカルスタッフ
 田中 克幸 (株)デンソー 本社 品質管理部 第1品質監査室 主任部員
 田中 健次 電気通信大学 大学院 教授 情報システム学研究所
 手塚 泉 (株)ルネサステクノロジ 品質保証統括部 汎用デバイス
 品質保証部 信頼性技術グループ グループマネージャ

中條 聡 (株)東芝 品質統括本部 品質推進室 参事
 二川 清 NECエレクトロニクス(株) 生産本部 テスト評価技術部
 シニアプロフェッショナル
 仁田 周一 サレジオ工業高等専門学校 教授/東京農工大学 名誉教授
 藤本 良一 (株)HII 航空宇宙事業本部 技師長(品質システム担当)
 堀籠 教夫 東京海洋大学 名誉教授
 益田 昭彦 帝京科学大学 客員教授 理工学部 環境科学科
 向殿 政彦 明治大学 教授 理工学部 情報科学科
 村上 孝 理工学部長 兼 理工学研究所委員長
 山 悟 (株)日本航空インターナショナル 整備本部 品質保証部
 副部長/品質マネジメント室長
 山田 雄愛 富士ゼロックス(株) 開発管理部 マネージャー
 若井 一顕 日本科学技術連盟 嘱託 (名城大学大学院客員教授)
 第一工業大学 教授 情報電子システム工学科
【顧問】 佐々木 正文 防衛大学校 名誉教授
 塩見 弘 日本科学技術連盟 参与
 額田 啓三 元 日東電工(株) 技師長
 真壁 肇 東京工業大学 名誉教授
 三根 久 京都大学 名誉教授

参加申込方法

「参加申込書」に必要事項をご記入の上、下記宛に FAX・郵送にてお申し込みください。
 また、ホームページから「参加申込書」をダウンロードし、E-mailでお申し込みも可能です。
 「開催通知」「参加券」「請求書」は、開催1ヶ月前からご送付致します。参加費は、請求書発行後2ヶ月以内に、請求書に記載してある銀行口座へお振り込みください。

参加費 (税込)

一般 39,900円
 日科技連賛助会員 (後援・協賛学会会員) 37,800円
 学生 (学生割引) 5,250円
 共同執筆者 (発表1件につきお一人) 18,900円
 2008年度 RDT 研究会・R-Map 実践研究会・SQiP 研究会会員 18,900円
 ※参加費は、当日欠席されてもお返し致しかねますので、ご了承ください。
 ※参加者以外、報文集は配付いたしません。また、報文集のみの頒布はいたしませんので、ご了承ください。

参加申込先

財団法人日本科学技術連盟
セミナー受付グループ
 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1
 TEL: 03-5378-1217 FAX: 03-5378-1220
 e-mail: regist@juse.or.jp
 日科技連ホームページ: http://www.juse.or.jp

シンポジウム内容に関する問合せ先

財団法人日本科学技術連盟
クオリティマネジメント一課 信頼性担当
 TEL: 03-5378-9850 FAX: 03-5378-9842
 e-mail: re-group@juse.or.jp

会場案内



日本教育会館 東京都千代田区一ツ橋2-6-2
道案内専用電話: 03-3230-2833
 ●東京メトロ半蔵門線「神保町」駅下車 (A8出口) 徒歩約3分
 ●地下鉄都営三田線「神保町」駅下車 (A1出口) 徒歩約5分
 ●東京メトロ東西線「竹橋」駅下車 (北の丸公園側出口) 徒歩約5分
 ●JR総武線「水道橋」駅下車 (西口出口) 徒歩15分

第38回 信頼性・保全性シンポジウム 参加申込書

●参加者 ※参加区分を必ずご記入ください。 **FAX: 03-5378-1220**

記入不要	参加者名 (ふりがな)	所属事業所・部課・役職・E-mail
参加区分	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 会員 (No.) <input type="checkbox"/> 共同執筆者 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 研究会会員	所属・役職: E-mail:
参加区分	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 会員 (No.) <input type="checkbox"/> 共同執筆者 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 研究会会員	所属・役職: E-mail:

●連絡担当者 (お申込み受理後「開催通知」「参加券・請求書」等をお送りする方)

会社名	事業所
所属・役職	担当者
所在地	電話
E-mail	FAX
後援・協賛団体の名称	会員番号

参加費	1. 一般	39,900円	×	名	円
	2. 日科技連賛助会員 (後援・協賛学会会員)	37,800円	×	名	円
	3. 学生 (学生割引)	5,250円	×	名	円
	4. 共同執筆者 (発表報文No.)	18,900円	×	名	円
	5. 2008年度RDT研究会・R-Map実践研究会・SQiP研究会会員	18,900円	×	名	円
	合計			名	円

※お支払いにつきましては、お申込み受理後、請求書と開催通知を併せてお送り致しますので、請求書発行後2ヶ月以内にお支払いください。
 ※ご記入いただきました企業・組織及び個人情報につきましては、参加申込受付処理及び事業運営のために、委員及び事務局が使用致します。
 また、日科技連からの情報の提供のために使用させていただきます。送付中止をご希望の方はチェックしてください。→ [] 送付中止

JULY 14-15, 2008 The 38th Symposium on Reliability and Maintainability

R&M参加者募集のご案内

**グローバルビジネスにおける「品質と信頼性」
 —ブランド戦略のコア・コンピタンス—**

2008年 **7月14日(月)~15日(火)**

会 場：日本教育会館 (東京・千代田区一ツ橋)

主 催：財団法人日本科学技術連盟

<http://www.juse.or.jp/>

後 援：日本信頼性学会
 協 賛：(社)情報処理学会 (社)電子情報通信学会 (社)電気学会 (社)日本品質管理学会 (社)日本機械学会
 (順不同) (社)日本オペレーションズ・リサーチ学会 (社)計測自動制御学会 (社)日本航空宇宙学会 (社)日本航空技術協会
 (財)日本電子部品信頼性センター (社)自動車技術会 (社)応用物理学会 IEEE Reliability Society Japan Chapter

参加のおすすめ

1971年に開始した当シンポジウムは、いろいろな分野の信頼性・保全性に携わるエンジニア、マネージャー、研究者の方々にご参加いただき、研究発表、事例発表、討論などを行うとともに、基調講演、特別講演、パネル討論会、チュートリアルセッション、展示コーナーなど、多彩な人的交流と情報交換の場を提供することを主眼として開催しており、国内外から高い評価を得ております。

今回のシンポジウムは、「グローバルビジネスにおける『品質と信頼性』—ブランド戦略のコア・コンピタンス—」をテーマに、例年通り開催いたします。

グローバルにビジネスを展開していくと、国や地域の文化・環境や安全規制を含む考え方や制約の「多様性」が自ずと関係してきます。これらの多様性を可視化・類型化し、理解して戦略的に対応を進めていくことは、企業経営の進化において不可欠であるだけでなく、使用の信頼性、モジュール化と共通化、グローバルな開発や生産体制の補完体制構築などにおいても重要な課題となっています。このような状況を踏まえ、「品質と信頼性」を取り巻く課題について考え、取り組みと進化の方向性などについて幅広く議論を深めていきます。

今回の特別講演は、一條和生教授にご講演いただきます。世界がフラット化する中で、グローバルに事業を伸ばすリーダーシップが企業に求められています。事業のグローバルな展開にあたって直面する「グローバル統合」と「ローカル適合」のジレンマを、いかにスピーディに解決できるかにグローバルな事業展開成功のカギは握られています。グローバルビジネスを創るリーダーシップについて、事例と理論的フレームワークを用いて説明いただきます。

貴社の信頼性活動を一層発展させるためにも、是非ともご参加ください!

<p>基調講演</p>  <p>グローバルビジネスにおける「品質と信頼性」—ブランド戦略のコア・コンピタンス— 宮村 鐵夫氏 中央大学 教授 理工学部経営システム工学科</p>	<p>特別講演</p>  <p>グローバルビジネスを創るリーダーシップ 一條 和生氏 一橋大学大学院 教授 国際企業戦略研究科</p>
--	---

パネル討論 リーダー **宮村 鐵夫氏**

 <p>北川 則道氏 (株)小松製作所 顧問</p>	 <p>袖川 芳之氏 (株)電通 消費者研究センター 情報サービス室 プランニング・ディレクター</p>	 <p>谷 みどり氏 (独)経済産業研究所 上席研究員</p>	 <p>鱈谷 佳和氏 (株)村田製作所 生産本部 資材部 部長</p>
---	---	---	---

チュートリアルセッション
 「先端LSIデバイス」金山 敏彦氏 (獨産業技術総合研究所)、生田目 俊秀氏 (株半導体先端テクノロジーズ)
 「ハード・ソフトウェア協調開発のプロジェクトマネジメント」金子 龍三氏 (株プロセスネットワーク)
 「リチウムイオン二次電池の信頼性・安全性」吉野 彰氏 (旭化成株)

第38回 信頼性・保全性シンポジウム

R&M 第38回 信頼性・保全性シンポジウム プログラム

グローバルビジネスにおける「品質と信頼性」— ブランド戦略のコア・コンピタンス —

2008年7月14日(月)～15日(火) 日本教育会館(東京・千代田区一ツ橋)
【受付】エレベータホール前 10:00～

- 一般発表 32件、チュートリアルセッション 4件：合計 36件
- 発表時間：持ち時間は1件につき30分(発表20分、質疑応答10分)

(敬称略)

2008年7月14日(月)

時間	会場：A・B会場 第一会議室(総合司会：木村 忠正 電気通信大学教授・報文小委員会委員長)									
10:30～10:40	主催者挨拶(財)日本科学技術連盟 理事長 浜中 順一									
10:40～11:40	基調講演:グローバルビジネスにおける「品質と信頼性」—ブランド戦略のコア・コンピタンス— 宮村 鐵夫 中央大学教授・組織委員会委員長									
11:40～12:10	2007年度(第37回)R&MS推奨報文賞・奨励報文賞・特別賞 表彰式 賞状・副賞の授与：宮村 鐵夫 中央大学教授・組織委員会委員長 選考理由について：佐藤 吉信 東京海洋大学教授・推奨報文小委員会委員長									
12:10～12:15	事務連絡:日科技連事務局									
12:15～13:30	昼食・休憩 (展示コーナー(807・808室)は11:30～18:00まで開催しておりますので、お時間のある時に是非お立ち寄りください)									
13:30～15:00	特別講演:グローバルビジネスを創るリーダーシップ 一條 和生(一橋大学大学院 教授 国際企業戦略研究科)									
15:00～15:30	休憩 (展示コーナー(807・808室)は11:30～18:00まで開催しておりますので、お時間のある時に是非お立ち寄りください)									
発表時間	A会場 (801・802室)		B会場 (803・804室)		C会場 (805・806室)(第二会議室)		D会場 (901室)		展示会場 (807・808室)[第二会議室]	
	Session 1	表面・界面の解析	Session 2	データ解析	Tutorial-Session 1	先端LSIデバイス	Session 3	信頼性・リスク管理	1日目	11:30～18:00
15:30～16:00	1-1	部品Auめっき厚さが実装強度に与える影響 パナソニックモバイルコミュニケーションズ(株) 芝 康介	2-1	鉄道信号装置のヘアピラリティを観点とした評価法の検討 鉄道総合技術研究所 岩田 浩司	—	15:30-15:40 チュートリアルセッションの紹介 (株)東芝 白田 宏治	3-1	画質評価の自動化によるトラブル流出防止 富士ゼロックス(株) 杉 伸介	2日目	9:30～15:00
16:00～16:30	1-2	表面分析による電氣的導通現象の解析 (株)デンソー 杉村 和男	2-2	ベイズ型情報量規準を用いた定数打ち切りデータにおけるパラメータ変化時点の推定 防衛大学校 田村 信幸	T1-1	15:40-16:35 極限性能 新構造トランジスタ基盤技術 (株)産業技術総合研究所 金山 敏彦	3-2	品質リスクの観点による継続的なソフトウェア評価の提案 (株)ニルソフトウェア 河合 一夫	【出展会社】 ・テックサポートマネジメント(有) ・楠本化成(株) ・(株)東レリサーチセンター ・山陽精工(株) ・(株)日立ハイテクノロジー ・JFEテクノリサーチ(株)	
16:30～17:00	1-3	接着信頼性の解析 (株)デンソー 長坂 進介	2-3	電子部品の信頼性試験計画の再考 三菱電機コントロールソフトウェア(株) 松岡 敏成	T1-2	16:35-17:30 極限EOTゲートスタック基盤技術 (株)半導体先端テクノロジーズ 生田目 俊秀	3-3	建設プロジェクトにおける初期故障と試運転調整・検査 鹿島建設(株) 泉山 浩郎	【世話人】 (株)デンソー 田中 克幸 (株)楠本化成(株) 井原 惇行	
17:00～17:30			2-4	輸送を再現する振動試験技術構築のためのフィールドデータの解析 (株)村田製作所 岡本 朗			3-4	自動車産業におけるリコールリスクのマネジメント 中央大学 大矢 真平		

2007年度(第37回)R&MS推奨報文賞・奨励報文賞・特別賞 表彰報文

表彰報文:発表報文の中から参加者の投票を基に選出されます。報文は、①創造性、②実用性、③完結性、④利用価値、⑤普遍性、⑥発表方法、⑦発表データの利用率の各項目で評価されます。なお、2007年度を受賞報文は次のとおりです。

【推奨報文賞】(所属は受賞時のものです)
・「航空機用7075アルミ合金の腐食環境下におけるshort crack挙動の評価」 岡田 孝雄(宇宙航空研究開発機構)
・「直交するノイズ評価を組み合わせた加速試験による定着装置の寿命評価」 武藤 弘次、原島 瑞晴(富士ゼロックス(株))
・「はんだ接合部の熱疲労寿命に及ぼす温度変化率の影響」 辻江 一作、青木 雄一(エスベック(株))、永井 孝幸(エスベックテストセンター(株))

【奨励報文賞】
・「エラーの種類に着目したエラープルーフに関する一考察」 青木 健、鈴木 和幸(電気通信大学)

【特別賞】
・「生産革新に対応した工程のFMEA・FTAによる品質問題の未然防止活動」 花村 和男(アイシン精機(株))、広瀬 幸雄(金沢大学)

2008年7月15日(火)

発表時間	A会場 (801・802室)		B会場 (803・804室)		C会場 (805・806室)(第二会議室)		D会場 (901室)		展示会場 (807・808室)[第二会議室]		
	Session 4	半導体の信頼性	Session 6	信頼性・リスク解析手法	Session 8	機械系の信頼性	Tutorial-Session 3	ハードウェア協調開発のプロジェクトマネジメント	3日目	9:30～15:00	
9:30～10:00	4-1	TCAD/PCMIによるトランジスタ特性ばらつき低減 (株)東芝セミコンダクター社 木下 浩三	6-1	製品開発における実践的PSリスクアセスメント手法～R-Mapからの展開～ 日立アプライアンス(株) 伊藤 淳	8-1	日本の空を飛んだジェットエンジンの発達に見る信頼性と安全性 (株)IHI 原田 實	「ハードウェア協調開発のプロジェクトマネジメント」 (株)プロセスネットワーク 金子 龍三	9:30～10:30 講演 10:30～11:15 質疑応答 11:15～11:30 総括・まとめ	【Tutorial-Session3】 ハードウェア協調開発のプロジェクトマネジメント 商品開発において組み込みソフトウェアは必要不可欠な存在となっています。また、工業製品の故障要因としてソフトウェアのバグ、ハードウェアの故障・劣化、そしてハードウェアの故障・劣化を感じずソフトウェア機能の不足があり、信頼性向上対策としてハードウェアとソフトウェアとの協調の重要性が増しています。本セッションでは「商品の多機能化に対応するハードウェアとソフトウェアとの協調開発」のための一助として、「ハードウェア技術者にとって、ソフトウェア分野での必要な知識・ものの見方・考え方」、「ハードウェアとソフトウェア開発が協調し、商品を統合的に開発するためのプロジェクトマネジメント」について説明します。		
10:00～10:30	4-2	キャリア注入TEGを用いたTDDMメカニズムの解明 (株)ルネサステクノロジ 桐山 賢	6-2	溶接工程不具合 (株)IHIエアロスペース 松井 直樹	8-2	改良ストップホール法による疲労耐久性向上に関する研究 トビー工業(株) 林 健治					
10:30～11:00	4-3	IR-OBIRCH法によるLTPS LCD故障解析技術 (株)アイテス 北川 みゆき	6-3	モンテカルロシミュレーションを用いた冗長システムのアンヘアピラリティ解析(その2) 東京海洋大学 西 干機	8-3	送電鉄塔における中空鋼管内面の腐食測度の推定と点検時期の検討 関西電力(株) 野村 憲一郎					
11:00～11:30	4-4	故障診断ツールによる効率的解析手法 東芝情報システムズ(株) 園田 裕司	6-4	FF式石油温風暖房機の安全解析(その2) 東京海洋大学 西 干機	8-4	自動車(部品)に対するストレス・ストレングスモデルを活用した故障確率の推定 アイシン精機(株) 藤田 禎雄					
11:30～12:30	昼食・休憩 (展示コーナー(807・808室)は9:30～15:00まで開催しておりますので、お時間のある時に是非お立ち寄りください)										
	Session 5	ウイスカの解析	Session 7	ワイブル解析	Tutorial-Session 2	リチウムイオン二次電池の信頼性・安全性	Session 9	ヒューマンファクター	4日目	9:30～15:00	
12:30-13:00	5-1	鉛フリーSnめっきにおける外部応力型ウイスカ/ノジュールの解析 ソニー(株) 水口 由紀子	7-1	順序制約に緩みを与えた2母集団のパラメータ推定に関する一考察 首都大学 長塚 豪己	「リチウムイオン二次電池の信頼性・安全性」 旭化成(株) 吉野 彰	9-1	作業中断時に発生するヒューマンエラーの解析:医療分野を主に 電気通信大学 稲葉 緑	9-2	危険認識ツールの開発について 関西電力(株) 小林 秀浩	【Tutorial-Session2】リチウムイオン二次電池の信頼性・安全性 リチウムイオン二次電池とは、1991年に商品化された電解液に有機溶媒を用いたはじめての二次電池です。商品化以降IT機器の普及に伴い小型・軽量の電源として世界中で広く用いられてきており、2007年には全世界で25億個以上生産されています。一方、近年このリチウムイオン二次電池の市場での品質トラブルが多発しています。そもそも二次電池とは電気エネルギーの塊であり、その品質をいかに保証するかが重要な開発のポイントでした。このリチウムイオン二次電池の開発経緯を振り返りながら、二次電池における品質保証の考え方、課題等について解説・紹介を行います。	
13:00-13:30	5-2	錫ウイスカの種類の解析事例 楠本化成(株) 神山 敦	7-2	三次元ワイブルプロットとその解析(その1) 電気通信大学 川村 比呂紀	12:30～13:30 講演 13:30～14:00 質疑応答	9-3	製品安全の再考察 日本科学技術連盟・囑託 柴田 義文				
13:30-14:00	5-3	アルミ電解コンデンサの故障解析事例 セイコーエプソン(株) 川人 祐介	7-3	三次元ワイブルプロットとその解析(その2) 電気通信大学 横山 真弘							
14:00-14:30	休憩 (展示コーナー(807・808室)は9:30～15:00まで開催しておりますので、お時間のある時に是非お立ち寄りください)										
14:30-16:30	会場：A・B会場 第一会議室										
	【パネル討論会】メインテーマ： グローバルビジネスにおける「品質と信頼性」—ブランド戦略のコア・コンピタンス—					【パネル討論】メンバー： リーダー：宮村 鐵夫(中央大学 教授 理工学部 経営システム工学科) メンバー：北川 則道(株)小松製作所 顧問 袖川 芳之(株)電通 消費者研究センター 情報サービス室 プランニング・ディレクター 谷 みどり(株)経済産業研究所 上席研究員 齋谷 佳和(株)村田製作所 生産本部 資材部 部長					
	【パネル討論内容】 グローバルビジネスにしたがって持続的な成長に「品質と信頼性」がどのような位置を占めるのかについて、「ブランド戦略」、「グローバル化と「品質」の確保—ものづくりの倫理」、「グローバルな開発・生産体制の構築」、「ライフサイクルマネジメントと品質・信頼性」、「持続的成長の技術戦略」、「安全と環境に関するregulationとhomologationの調和による持続的成長と産業政策」などの視点から、幅広くかつ掘り下げた議論を進めていきます。										

*プログラム内容は、変更になる場合がございます。 *司会者および(補佐)は組織委員です。補佐の所属は略しています。